



Lyncée tec^{DHM}

デジタル・ホログラフィック顕微鏡セミナー2013大阪

～*No Scanning* が可能にする表面観察の世界

主な講演内容

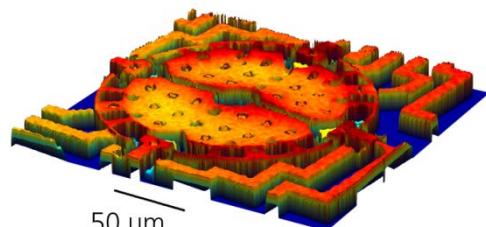
- **DHMの原理、アプリケーション**
～レーザ顕微鏡、白色干渉計との比較
- ***No Scanning* がもたらすメリット**
～高速広域測定
- MEMSやバイオなど**リアルタイム**
3次元測定

【新技術発表】

“*Reflectometry Module*”

～薄さ1 μm 以下の
透明膜測定に朗報！

☆実機による**デモンストレーション**
DHMの使いやすさを体感！



Height: 10 μm

MEMSデバイス

◆アプリケーション

- ・表面粗さ評価
- ・MEMS
- ・微小デバイス
- ・高速広域測定
- ・透明薄膜
- ・マイクロレンズ
- ・品質管理 ほか



2013年11月15日(金) 13:00～16:30
CIVI(シーヴィー)新大阪研修センターにて

無料



Lyncée tec^{DHM}

デジタル・ホログラフィック顕微鏡セミナー2013大阪

☆このような方に最適です

- ・ レーザ顕微鏡や白色干渉計をご検討中
- ・ すでに使用しているけど、困っている
- ・ 分析ラボの外(製造現場やQCライン)で使いたい
- ・ 透明膜がうまく測定できない

日本カンタム・デザインでは2012年秋よりスイスLyncéeTec社製デジタル・ホログラフィック顕微鏡の取扱いを開始いたしました。従来、レーザ顕微鏡や白色干渉計などで行われる3次元での表面観察・粗さ分析の分野において、新たなソリューションを提供できる技術と考えております。

今回のセミナーでは、デジタル・ホログラフィック顕微鏡を身近に感じていただくために、従来技術との比較や実機を用いたデモンストレーションを中心とした企画をご用意しております。また、最新の技術発表として、厚さ1 μ m以下、数十nmまでの透明膜の測定が可能になる「Reflectometry Module」をご紹介します。

■開催日時：2013年11月15日(金) 13:00～16:30 (受付12:30～)

■開催場所：CIVI(シーヴィー)新大阪研修センター 905D

(JR「新大阪」駅、地下鉄御堂筋線「新大阪」駅から徒歩7分
地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅、阪急「南方」駅から徒歩4分)

■参加費：無料

■申込：申込専用フォームよりお申込みください。
※申込締切：11月8日(金)
※定員に達し次第、締め切らせていただきます。

■問合せ先：日本カンタム・デザイン
セールス&マーケティング本部 片倉、荒木
TEL: 03-5964-6624 / Mail: info@qdj.co.jp



Quantum Design Japan

日本カンタム・デザイン株式会社

〒171-0042
東京都豊島区高松1-11-16 西池袋フジタビル2F
Phone:03-5964-6624 / FAX:03-5964-6621
http://www.qd-japan.com / Email: info@qdj.co.jp